

有機・無機異物分析Webセミナー

- 日 時： 2020年9月16日(水) 9:30~11:35(受付9:20~) ●参加費：無料 ●定員：先着80名
- 主 催：株式会社ミツワフロンテック
- 協 力：ユーロフィン分析科学研究所株式会社 ブルカージャパン株式会社
- 開催方法：Teams(申し込み後、メールにてご案内致します)
- 申し込みURL：https://www.mitsuwa.co.jp/news/seminar/appli/20200916_webseminar/
- 問い合わせ先：(株)ミツワフロンテック TEL:06-6351-9677 担当：圓奈(えんな)、平田

概要：近年、製造技術の進歩や製品の多様化により様々な業界で異物分析・解析の重要度が高まってきており、複雑、微小なサンプルに対しても迅速なアプローチを要求されております。本セミナーではそのような異物分析におけるノウハウ・テクニックを紹介させて頂きますと共に、異物分析の最新情報をお届け致します。

■プログラム

9:30~9:35	開会の挨拶
<div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 5px; text-align: center;">招待講演</div> 9:35~10:35	 <p>「スピーディかつ正確に～異物分析技術と測定事例のご紹介～」 ユーロフィン分析科学研究所株式会社 分析研究第2部 井本 淳子 様</p> <p>材料や製品に異物が発見された場合、一刻も早い異物の特定が求められます。私たちは、医薬品微小異物の分析においては20年以上の実績を有しています。今回は、異物分析手法、サンプリングおよび前処理技術について、分析事例を交えてご紹介します。</p>
10:35~11:05	<p>「異物分析における顕微赤外・ラマンシステムの有用性と測定事例について」 ブルカージャパン株式会社 オプティクス事業部 松原 智之 氏</p> <p>昨今、各種製品の小型・微細化に伴い、定性が要求される異物サイズも微小化しています。異物の種類も有機、無機、複合物等さまざま、その分析手法も多岐にわたって存在します。今回は、簡便な操作性ながら精度・スピードが大きく向上した顕微赤外システム LUMOS II と 顕微ラマンシステム SENTERRA II の特徴と測定事例についてご紹介します。</p> 
11:05~11:35	<p>「M4 TORNADO PLUS 超軽元素分析対応μ-XRFによる異物分析の展望」 ブルカージャパン株式会社 ナノ分析事業部 水平 学 氏</p> <p>蛍光X線分析は、非破壊のうえ短時間で分析を行うことができ、スクリーニング分析としても幅広く活用されています。今回は量産型μXRFとして世界で初めて、C～Amの範囲でマッピングによる元素分布測定が可能なM4 TORNADO PLUSと新しい異物分析の世界をご紹介します。</p> 

※上記講演内容、講演者は予定であり、予告なく変更させて頂く場合がございます。
 ※お申込みにより頂きました個人情報につきましては本セミナー受付と、以降のお客様への情報提供に用います。
 個人情報の保護につきましては、弊社ホームページに掲載しております[プライバシーポリシー](#)をご参照下さい。
 (株)ミツワフロンテック <https://www.mitsuwa.co.jp/privacy/>